

性能优异的800G光模块测试解决方案

针对实验室和生产线设计

EXFO

了解业内知名的光模块测试解决方案



BA-4000误码仪

BA-4000是一个误码仪系列，其中的BA-4000-8-56-PAM是400G/800G误码仪，适用于8通道NRZ 56 Gbit/s或8通道PAM4 56 GBd测试。该系列误码仪是对新一代光模块、FPGA和MCB进行质量管理和验证的理想工具。其功能包括第1层FEC符号错误（FEC symbol error）、FEC余量（FEC margin）、丢帧率和Scramble Idle码型测试。借助这款易用的解决方案，可实现完整的通道控制、预加重和均衡调整。

MA-4000模块分析仪

功能多样的一体化误码率分析解决方案，它结合了BA-4000的测试功能并集成了可替换的MCB。不再需要射频线缆。支持NRZ和PAM4编码。非常适用于对量产的25G至400G光模块进行鉴定和温循测试。

2021 LIGHTWAVE INNOVATION REVIEWS



EA-4000眼图分析仪

超高速信号电/光采样示波器，支持28G NRZ眼图测试分析。该系列示波器有多个单模和多模型号可供选择，覆盖从830 nm到1600 nm的波长。超高速采样示波器（100万次采样/秒）。性能出色，抖动非常低。支持25G-100G标准模板（MSA）。

CD-4000时钟数据恢复仪（CDR）

28G/56Gb光接口与电接口CDR支持NRZ与PAM4调制信号。光接口CDR支持850 nm至1650 nm的单模或多模信号。随机抖动非常低。内置分光器。



欲知详情，敬请访问www.EXFO.com或联系当地销售代表。